



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 認証書 独立試験所

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0003-01 発行番号: 2 認証状況: 継続中

追加の認証サイト: [IECQ-L JQAJP 13.0003](#) 初回発行日: 2009/07/24

旧認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0003-01 発行日: 2014/07/18 初回発行日: 2009/07/24  
Issue1

CB 管理番号: JQAQ0010-002-T 有効期限: 2015/07/27

楠本化成株式会社 エタック事業部 信頼性クリニック  
山形試験所  
〒999-3716 山形県東根市蟹沢 1 7 0 2 - 3

当該組織、設備及びその手順は、IECQ電子部品品質認証制度において、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-6「独立試験所審査プログラム要求事項」、及びISO/IEC17025:2005のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

認証範囲:

添付 附属書参照

詳細は添付 附属書参照

発行認証機関 (CB):

**JQA**

Japan Quality Assurance Organization (JQA)  
一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

部門長: 近藤 繁 幸

ウェブサイト: [www.jqa.jp](http://www.jqa.jp)

IECQ メンバーボディ:

**jisc**

Japanese Industrial Standards Committee

JISC - Japanese Industrial Standards Committee  
日本工業標準調査会

ウェブサイト: [www.meti.go.jp](http://www.meti.go.jp)

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0003-01

CB 管理番号: JQAQ 0010-002-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0003-01-SJ

改訂番号: 2

改訂日: 2014/07/18

ページ 1/1

部品の種類

IEC 60384-1 (電子機器用固定コンデンサ)

環境試験

IEC 60068-2-1 (試験記号 A: 低温 (耐寒性) 試験)

IEC 60068-2-2 (試験記号 B: 高温 (耐熱性) 試験)

IEC 60068-2-14 (試験記号 N: 温度変化試験)

IEC 60068-2-38 (試験記号 Z/AD: 温湿度組合せ (サイクル) 試験)

IEC 60068-2-42 (試験記号 Kc: 接点及び接続部の二酸化硫黄試験)

IEC 60068-2-43 (試験記号 Kd: 接点及び接続部の硫化水素試験)

IEC 60068-2-78 (試験記号 Cab: 高温高湿 (定常) 試験方法)

機械的試験

IEC 60068-2-6 (試験記号 Fc: 正弦波振動試験)

IEC 60068-2-64 (試験記号 Fn: 広帯域ランダム振動試験)

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒157-8573 東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号